

低真空走査電子顕微鏡活用セミナー

参加費無料 定員 10 名

1. 概 要

走査電子顕微鏡（以下「SEM」という）は、試料表面に電子線を走査させることで、試料表面の形状観察や元素分析ができる装置です。通常の SEM の場合、食品や生体材料等の水分を含む試料は観察出来ません。しかし、今年度、当センターに導入された低真空 SEM では、低真空モードにより、これら試料の観察が可能です。

本セミナーでは、SEM の基本的な原理や操作方法の説明に加え、良い画像を得る為の観察のコツや元素分析の方法などを、実習形式にて紹介致します。

2. 開催日時・場所

【日 程】 平成 30 年 3 月 5 日（月）および 6 日（火）（2 日間とも同じプログラムです）

【時 間】 10：00～16：00（予定）

【会 場】 地方独立行政法人山口県産業技術センター 会議室（3F）および表面解析研究室
（宇部市あすとぴあ 4 丁目 1－1）

3. 対 象

SEM により工業材料等の表面観察及び元素分析を行われている方、その他 SEM に興味のある方

4. 講師及び研修プログラム

【講師】

日本電子株式会社 SM アプリケーション部 中嶋香織氏

【プログラム】

座 学 3 月 5 日および 6 日	
10：00～ 12：00	①SEM のしくみ（装置構成） ②SEM 観察（高真空モード、低真空モード） ③元素分析
実 習 3 月 5 日および 6 日	
13：00～ 16：00	①試料導入方法および SEM 観察（高真空モード、低真空モード） ②定性・定量分析（点分析、線分析、マッピング等） ③持参試料の観察・元素分析※

※観察・元素分析を希望する試料がございましたら、2 月 23 日（金）（必着）までに担当者（有富）へご提出下さい。ただし、1 社 1 試料に限ります（実習では 5 試料程度）。試料によっては観察が行えない場合（例：果物等、水分があまりにも多く含まれているもの）もございますのでご容赦下さい。試料の観察画像および成分分析結果について、参加された方に閲覧して頂きますのでご了承下さい。

5. 申込方法

申込書にご記入のうえ、FAX または E メールにてお申し込み下さい。

申込締切 2 月 23 日（金）

6. 装置紹介



低真空走査電子顕微鏡（JSM-IT500LA、日本電子（株））

低真空走査電子顕微鏡活用セミナー参加申込書

FAX : 0836-53-5070

E-mail : soudan@iti-yamaguchi.or.jp

● 本申込書に必要事項を記入し、ファックスでお申し込み下さい。

● 必要事項の記載された電子メールでもお申し込み可能です。

(地独) 山口県産業技術センター 企業支援部技術相談室 宛

会社・団体名:

所在地: (〒 -)

連絡先: TEL - - FAX - -

参加者氏名	E-mail	希望日 (○で囲む)	持参試料 (○で囲む)
		5日・6日	有 ・ 無

試料の内容について記入して下さい

※ 参加申込書に記載された個人情報は、申し込み内容の確認、参加者名簿の作成及び次回以降の開催案内にのみ利用します。

※ 応募状況により各社1名となるようにお願いすることがあります。

◆ お手数ですが、2月23日(金)までに本参加申込書をご送信ください。

◆ 会場案内図



◆ お問い合わせ

〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ4丁目1-1

(地独) 山口県産業技術センター 企業支援部 技術相談室 (担当: 有富)

TEL : 0836-53-5053 Fax : 0836-53-5070

E-mail : soudan@iti-yamaguchi.or.jp URL <http://www.iti-yamaguchi.or.jp/>